第 41 卷 第 5 期 2021 年 10 月

桂林电子科技大学学报 Journal of Guilin University of Electronic Technology

Vol. 41, No. 5 Oct. 2021

基于纳米压痕法的富 Sn 相应力-应变关系的研究

刘志高1,侯斌2,刘天寒1,秦红波1

(1. 桂林电子科技大学 机电工程学院,广西 桂林 541004; 2. 广东省焊接技术研究所,广州 510651)

摘 要:在电子封装领域中,所用的无铅钎料主要是二元或者三元 Sn 基共晶或近共晶合金,其基体相为富 Sn 相。为得到富 Sn 相的力学性能及应力-应变关系,由纳米压痕试验测试获得了富 Sn 相的弹性模量与硬度,并得到载荷-位移曲线。采用有限元反演分析的方法确定了富 Sn 相的特征应力和特征应变,并由量纲函数确定应变强化指数。将特征应力和特征应变强化指数等参数代人幂强化模型中,计算得到富 Sn 相的屈服强度为 31.51 MPa,并最终确定富 Sn 相的应力-应变关系函数表达式。

关键词:富 Sn 相;纳米压痕法;有限元分析;反演分析;应力-应变关系

(中图分类号: TG425.1

7:202205.001

文献标志码: A

文章编号: 1673-808X(2021)05-0000-00

Research on the stress-strain relationship of Sn-rich phase based on nanoindentation

LIU Zhigao¹, HOU Bin², LIU Tianhan¹, QIN Hongbo¹

(1. School of Mechatronic Engineering, Guilin University of Electronic Technology, Guilin 541004, China; 2. Guangdong Welding Institute, Guangzhou 510651, China)

Abstract: At present, the lead-free solders used are mainly binary or ternary Sn-based eutectic or near-eutectic alloys in the field of electronic packaging, and the matrix phase is Sn-rich phase. In order to obtain the mechanical properties and stress-strain relation of the Sn-rich phase, the elastic modulus E and the hardness H of the Sn-rich phase were obtained by nanoin-dentation test, and the load-displacement curve was obtained. Then, the representative stress and representative strain of the Sn-rich phase are determined by the finite element reverse analysis method, and the strain hardening exponent n was determined by the dimensional function. Finally, the above parameters were substituted into the power-law stress-strain behavior model, the yield strength of Sn-rich phase was calculated to be 31.51 MPa, and the expression of stress-strain relation function of Sn-rich phase was finally determined.

Key words: Sn-rich phase; nanoindentation; finite element analysis; reverse analysis; stress-strain relationship

电子封装从广义上讲就是将构成电子产品的各种晶体管、裸芯片、引线、电路、基板和其它封装材料等按照规定或者设计的要求合理密封、布置、固定和连接,实现与外部环境隔离、屏蔽及保护,最终组装成电子产品的整个工艺过程,而狭义的电子封装则是指将半导体晶体管或裸芯片密封、固定并引出接线端子

的工艺技术,从而实现对晶体管或裸芯片的保护并增强其环境适应性^[1]。在电子封装领域,焊点有机械支撑、电气连接与信号通道的用途。国内外研究者已达成共识:电子封装系统中最薄弱的环节是焊点,焊点的力学失效引起了电子产品和设备的失效。随着电子产品小型化、便携化、多功能化的发展趋势,电子封

收稿日期: 2020-04-26

基金项目: 国家自然科学基金(51505095,51805103);广西自然科学基金(2018GXNSFAA281222);广西科技计划(AD18281022);桂林电子科技 大学研究生教育创新计划(2020YCXS001,2019YCXS002)

通信作者:秦红波(1986—),男,副教授,博士,研究方向为电子元器件与微纳结构可靠性,电子封装材料、焊接材料与工艺,工程有限元分析。E-mails: qinhb@guet, edu. cn

引文格式: 刘志高,侯斌,刘天寒,等. 基于纳米压痕法的富 Sn 相应力一应变关系的研究[J]. 桂林电子科技大学学报,2021,41(5);

50

装密度不断提高,焊点尺寸持续减小。例如,与传统的球栅阵列(BGA,焊球直径 700~1 000 μ m)和微球栅阵列(μ -BGA,焊球直径 300~500 μ m^[2])微焊点相比,目前典型倒装芯片微焊点直径达到 100 μ m 以下,2024 年将达到 35 μ m^[3]。

值得注意的是,焊点力学行为表征和失效分析的 重要依据是材料或者物相力学性能和应力-应变关 系。由于万能拉伸机测得的大尺寸试样不能很好地 表征微焊点中材料或者物相的微观力学行为[4],纳米 压痕技术的出现为微焊点力学性能测量提供了手段。 纳米压痕技术通过得到的载荷-位移的关系曲线,从 而得到微焊点材料及其物相的硬度、弹性模量、蠕变 等力学性能,例如:Chromik 等[5] 通过纳米压痕测试 获得了微焊点中 Ag₃Sn、Cu₆Sn₅ 和 Cu₃Sn 等金属间 化合物的硬度及弹性模量等力学性能;孙祥霞等[6]借 助纳米压痕试验方法,研究了 Bi 和 Ni 对 Cu/SAC/ Cn 微焊点体钎料蠕变性能的影响;Xiao 等[7] 通过纳 米压痕的方法研究了 Sn-3. 0Ag-0. 5Cu/Cu 接头界面 处金属间化合物的硬度、弹性模量和蠕变与应变速率 之间的关系;王凤江等[8]利用纳米压痕技术测量了 Sn-Ag-Cu 无铅钎料 BGA 焊点的弹性模量。此外, 通过纳米压痕技术还可构建金属材料的应力-应变关 系函数表达式(力学本构方程),例如:Dao 等[9]提出 了特征应力和特征应变的概念,并建立了可以求解金 属材料塑性性能的量纲函数;马永等[10]认为可在 Dao 等^[9]提出的理论基础上利用纳米压痕技术和有 限元反演分析确定弹性模量 E 为 55~600 GPa、屈服 强度 σ, 为 0.1~10 GPa、应变强化指数 n 为 0~0.6 的金属材料的屈服强度及应变强化指数等塑性性能; 秦飞等[11] 基于马永等[10] 的反演分析方法,并利用 Dao 等[9]建立的量纲函数,确定了电子封装微互联结 构 TSV-Cu 的屈服强度等力学性能参数和弹塑性力 学本构方程(应力-应变关系函数表达式)。

在电子工业中,目前开发的无铅钎料(如 SnAg、SnCu、SnAgCu 和 SnBi 等)大多以富 Sn 相为基体^[12],富 Sn 相的应力应变关系很大程度决定了微焊点的力学失效行为。目前,针对无铅钎料合金应力应变关系的研究较多^[13],而钎料合金微观组织中富 Sn 相应力-应变关系尚不明确,导致无法进行微观组织力学行为分析。基于上述研究背景和现状,制备了典型无铅钎料 SnBi 合金中的富 Sn 相单相固溶体试样,采用纳米压痕技术测试了该富 Sn 相固溶体试样的载荷-位移曲线,通过马永等^[10]提出的反演分析方法,将有限元模拟结果与纳米压痕试验测试所得结果作对比,并利用 Dao 等^[9]建立的量纲函数,最终得出

富 Sn 相的应力-应变关系函数表达式。

1 试验方法

1.1 单相固溶体的制备及纳米压痕试验的参数

Sn-Bi 钎料合金中,富 Sn 相是 Bi 原子溶解在 Sn 中的单相固溶体, Bi 在 Sn 中的固溶度为 1.5 at%[14]。1)原材料选取纯度为99.995%的Sn锭和 Bi 块,将它们切割成小块状,用高精密天平对其进 行称量, 金属 Sn 的质量为 600, 000 g, 金属 Bi 质量 为 16.080 g; 2) 在坩埚中加入 50 g 松香作为抗氧化 剂和覆盖剂,将锡炉温度调整到 250 ℃,待松香融 化后加入称量好的金属 Sn 和金属 Bi; 3)等金属完 全熔化后,锡炉保持 250 ℃ 1 h 并每隔 10 min 用玻 璃棒搅拌一次金属,将坩埚取出并将其中的液态金 属倒入钢制模具中,凝固后打开模具,取出富 Sn 相 固溶体合金;4)利用线切割的方法将制备的富 Sn 相固溶体合金切割出一块边长约为 10 mm 的正方 体试样,剩余的固溶体合金根据 GBT/228.1-2010 机加工成总长度为 90 mm,长度方向中间受力处横 截面积为 2.0×5.0 mm² 的犬骨状试样,用于拉伸 试验,将正方体试样放置到树脂与固化剂的质量比 为5:4的水晶胶中,待水晶胶凝固后,采用系列砂纸 打磨、抛光制备金相试样,以用于后续的纳米压痕 试验测试。

纳米压痕试验采用的设备是安捷伦 G200 纳米压痕仪,该设备位移分辨率为 0.01 nm,载荷分辨率为 50 nN。试验采用 Berkovich 压头,对富 Sn 相金相试样进行纳米压痕试验测试。纳米压痕试验测试点为 5 个,压入深度均为 500 nm,加载应变率为 $0.05~\text{s}^{-1}$ 。

1.2 试验原理

金属材料的塑性性能常采用幂强化模型来描述, 对于各向同性材料,弹塑性应力-应变关系为

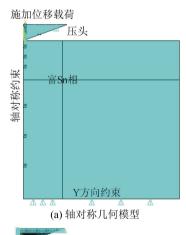
$$\sigma = \begin{cases} E\varepsilon, \sigma \leqslant \sigma_{y}, \\ R\varepsilon^{n} = \sigma_{y} \left(1 + \frac{E}{\sigma_{y}}\varepsilon_{p}\right)^{n}, \sigma > \sigma_{y}, \end{cases}$$
(1)

其中: E 为弹性模量; R 为强度系数; n 为应变强化指数; σ_v 为屈服强度; ε_p 为塑性应变。弹性模量 E 可由纳米压痕测试得到, 并记录试验载荷-位移曲线; 屈服强度 σ_v 和应变强化指数 n 则需特征应力、特征应变与量纲函数 ε_p 确定, 其中特征应力 ε_p 和特征应变 ε_p 是应力应变曲线上一个代表点的值, 可以由有限元反演方法确定 ε_p 。将这些参数代入幂强化模型中,得出富 Sn 相的应力-应变关系函数表达式。

1.3 有限元仿真

在结构轴对称时,二维轴对称有限元模型与三维 轴对称有限元模型具有相同的精度[10]。因此,为了 更好地提高运算效率,在 ANSYS 软件中采用二维轴 对称有限元模型对纳米压痕测试的加载阶段进行模 拟仿真。在二维有限元模型(见图1)中,单元类型采 用 PLANE182 单元,选取 TRAGE169 和 CON-TA172作为接触单元。Berkovich 压头可以等效为 顶角为 140.6°的圆锥压头[15],在二维轴对称模型中 压头可以等效为顶角(靠近试样的角)为 70.3°的三 角形,被压试样为边长 40 μm 的正方形。为了在节 省运算时间的同时,确保运算的准确性,对模型中左 上角 $10 \times 10 \ \mu m^2$ 的区域进行局部网格细化,共 6 400 个网格。在富 Sn 相有限元模型中,单元数和节点数 分别为 12 100 和 12 310。对底边的节点施加 Y 方向 的约束,沿对称轴上的节点施加对称约束,加载条件 与试验测试情况一致。

chinaXiv:202205.0



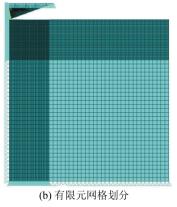


图 1 有限元模型

2 实验结果与分析

2.1 纳米压痕试验的结果

对富 Sn 相进行纳米压痕测试,得到 5 个测试点

的弹性模量和硬度的值,弹性模量的平均值为 61.10 GPa,硬度的平均值为 0.37 GPa,试验结果见表 1。图 2(a)给出了试验测试中加载阶段的 5个测试点的载荷位移曲线及其平均载荷位移曲线。根据文献 [16],将平均载荷位移曲线拟合为抛物线函数曲线,如图 2(b)所示。

表 1 富 Sn 相的弹性模量 E 和硬度 H

测试点	E/GPa	H/GPa
1	59.62	0.33
2	61.18	0.37
3	61.65	0.37
4	61.10	0.36
5	61.95	0.44
平均值	61.10	0.37

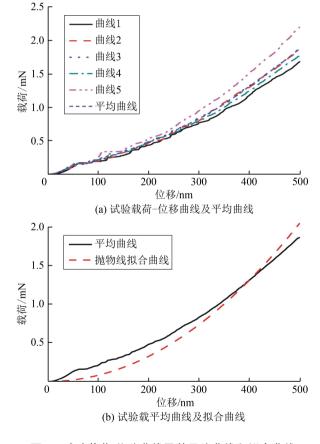


图 2 试验载荷-位移曲线及其平均曲线和拟合曲线

2.2 应力应变关系函数表达式确定

2.2.1 特征应力的确定

根据 Dao 等^[9] 的理论,当金属材料具有相同特征应力、特征应变和弹性模量时,可以得到相同的加载阶段载荷-位移曲线。因此,在应变强化指数 n=0的情况下(ANSYS 采用 BISO 模型,将 BISO 模型的

2021年10月

屈服强度假设为富 Sn 相特征应力的值),根据文献 [17]和式(2)估算特征应力 $σ_r$ 。

$$\frac{E_{\rm r}}{H} = 0.231 \left(\frac{E_{\rm r}}{\sigma_{\rm r}}\right) + 4.910,$$
 (2)

其中:E, 为等效弹性模量;H 为硬度。

$$\frac{1}{E_{\rm r}} = \frac{1 - \nu^2}{E} + \frac{1 - \nu_{\rm i}^2}{E_{\rm i}},\tag{3}$$

其中:富 Sn 相试样的泊松比 ν 为 0. 33; 压头的泊松 比 ν_i 为 0. 07; 富 Sn 相试样的弹性模量 E 为 61. 10 GPa; 压头的弹性模量 E_i 为 1 141 GPa。将富 Sn 相和压头的材料参数输入 ANSYS 中进行反演分析,当最大模拟载荷 F_{\max}^{FEM} 与最大试验载荷 F_{\max}^{EXP} 的误差大于 0. 5%,则按式(4)进行迭代。

$$\sigma_r(i+1) = \sigma_r(i) \frac{F_{\text{max}}^{\text{EXP}}}{F_{\text{max}}^{\text{FEM}}}, \tag{4}$$

其中: $\sigma_r(i)$ 为第 i 次迭代的特征应力; $\sigma_r(i+1)$ 为第 i+1 次迭代的特征应力。当得到的模拟最大载荷 F^{EXP} 和试验最大载荷 $F^{\text{EXP}}_{\text{max}}$ 误差小于 0.5 且模拟载荷-位移曲线与试验载荷-位移曲线一致时,迭代结束,最终确定特征应力 σ_r 取 82.84 MPa,如图 3 所示。

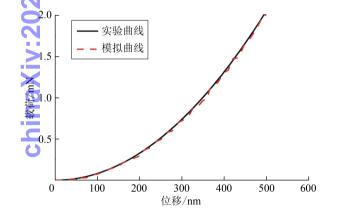


图 3 当 n=0 时的试验载荷-位移曲线和模拟载荷-位移曲线

2.2.2 应变强化指数的确定

由纳米压痕试验得到卸载后的残余深度 h_r 和最大压深 h_m 值, h_r 的平均值为 518. 829 0 nm, h_m 的平均值为 534. 224 9 nm,如表 2 所示。根据 Dao 等^[9] 提出的量纲函数,将 h_r 、 h_m 的值代入式(5),经计算,应变强化指数 n=0. 309 6。

$$\frac{h_{\rm r}}{h_{\rm m}} = (0.010\ 100n^2 + 0.001\ 796\ 39n - 0.004\ 083\ 7) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^3 + (0.143\ 86n^2 + 0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{\rm r}}{E_{\rm r}} \right) \right]^2 + (0.018\ 153n - 0.088\ 198) \left[\ln \left($$

表 2 残余深度 h_r 和最大压深 h_m

测试点	$h_{ m r}/{ m nm}$	$h_{\mathrm{m}}/\mathrm{nm}$
1	513.895 0	535. 224 9
2	518.981 9	534.3038
3	519.0380	534.554 2
4	516.357 9	530.9047
5	525.874 3	539. 312 6
平均值	518.829 0	534.8600

$$(0.059 505n^{2} + 0.034 074n - 0.654 17) \left[\ln \left(\frac{\sigma_{r}}{E_{r}} \right) \right] +$$

$$(0.581 80n^{2} - 0.088 460n - 0.672 90)_{\circ}$$
 (5)

2.2.3 特征应变与应力应变关系函数表达式的确定根据文献[18],富 Sn 相的特征应变 ε_r 可由式 (6)估算得到:

$$\varepsilon_{\rm r} = \exp(-3.91 + 166.7/(E_{\rm r}/\sigma_{\rm r} + 177.3))_{\circ}$$
 (6)

将得到的特征应力 σ_r 、应变强化指数 n 和估算的特征应变 ε_r 代入幂强化模型中(即 $n \neq 0$ 时),可以得出一系列应力-塑性应变点的值,将这些值输入材料属性进行有限元模拟。若最大模拟载荷 F_{\max}^{FEM} 与最大试验载荷 F_{\max}^{EXP} 的误差大于 0.5%,则按照式 (7) 进行迭代。

$$\varepsilon_{\rm r}(i+1) = \varepsilon_{\rm r}(i) \frac{F_{\rm max}^{\rm FEM}}{F_{\rm exp}},$$
(7)

其中: $\epsilon_{\rm r}(i)$ 为第 i 次迭代的特征应变; $\epsilon_{\rm r}(i+1)$ 为第 i+1 次迭代的特征应变。当得到的模拟最大载荷 $F_{\rm max}^{\rm FEM}$ 误差小于 0.5%且模拟载荷-位移曲线与试验载荷-位移曲线一致时,迭代结束,最终确定特征应变 $\epsilon_{\rm r}$ 为 0.011 2,如图 4 所示。将已经确定的富 Sn 相的材料参数代入幂强化模型中,最终计算得到富 Sn 相的屈服强度 $\sigma_{\rm v}$ 为 31.51 MPa。

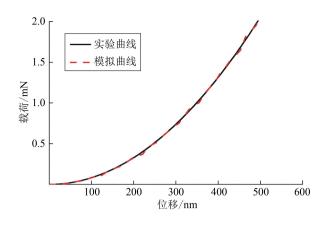
综上,本研究中富 Sn 相的应力应变关系函数表 达式为

$$\sigma = \begin{cases} 61 \ 100\varepsilon, \sigma \leqslant 31.51; \\ 31.51(1+1939.07\varepsilon_{p})^{0.3096}, \sigma > 31.51. \end{cases}$$
(8)

2.3 拉伸试验验证

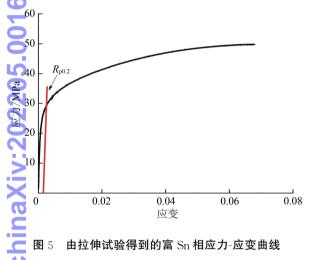
为了验证采用反演分析方法得到的富 Sn 相应力-应变关系函数表达式的准确性,根据 GBT/228.1—2010 对长度方向中间受力处横截面积为 $2.0 \times 5.0 \text{ mm}^2$ 的富 Sn 相犬骨状试样进行拉伸试验,得到应力-应变曲线,如图(5)所示。拉伸试验测试中所采用的引伸计标距为 25 mm,将试样发生 0.2%塑性变形($R_{10,2}$)时的应力 29.67 MPa 作为屈服强度,与反

53



 $n\neq 0$ 时的试验载荷-曲线位移和模拟载荷-位移曲线

演分析所得的屈服强度 31.51 MPa 相接近,可验证 本研究通过反演分析得到的富 Sn 相应力-应变关系 函数表达式是正确的。



由拉伸试验得到的富 Sn 相应力-应变曲线

结束语

- 1) 由纳米压痕试验测得富 Sn 相的弹性模量 E 和硬度 H 分别为 61.10 GPa 和 0.37 GPa。
- 2) 将纳米压痕试验测试和有限元反演分析相结 合,得到了富 Sn 相的应力-应变关系函数表达式,利 用拉伸试验验证了反演分析结果的正确性。
- 3) 所得富 Sn 相的力学性能参数及应力应变关 系函数表达式对 Sn 基微焊点微观力学行为研究、力 学失效行为分析及可靠性评估具有较为重要的意义。

参考文献:

- [1] 秦红波. 无铅微互连焊点力学性能及疲劳与电迁移行为 的尺寸效应研究[D]. 广州:华南理工大学,2014:3-4.
- [2] TONG HM, LAIYS, WONG CP. Advanced flip chip packaging[M]. Boston: Springer, 2013: 23-27.
- [3] HOEFFLINGER B. ITRS: the international technology

- roadmap for semiconductors [M]. Heidelberg: Springer, 2011:161-174.
- 秦红波,李望云,李勋平,等. BGA 结构无铅微焊点的 $\lceil 4 \rceil$ 低周疲劳行为研究[1]. 机械工程学报,2014,50(20): 54-62.
- [5] CHROKMIK R R, VINCI R P, ALLEN S L, et al. Measuring the mechanical properties of Cu₆Sn₅ and Cu3Sn intermetallics by nanoindentation [J]. JOM, 2003,55(6):66-69.
- 「6] 孔祥霞,孙凤莲,杨淼森,等. Bi 和 Ni 元素对 Cu/SAC/ Cu 微焊点体钎料蠕变性能的影响[J]. 机械工程学报, 2017,53(2):53-60.
- [7] XIAO Gesheng, YANG Xuexia, YUAN Guozheng, et al. Mechanical properties of intermetallic compounds at the Sn-3. 0Ag-0. 5Cu/Cu joint interface using nanoindentation[J], Materials and Design, 2015, 88: 520-527.
- 王凤江,钱乙余,马鑫.纳米压痕法测量 Sn-Ag-Cu 无铅 [8] 钎料 BGA 焊点的力学性能参数[J]. 金属学报,2005, 32(4):1-4.
- [9] DAO M, CHOLLACOOP N, VAN V K J, et al. Computational modeling of the forward and reverse problems in instrumented sharp indentation [J]. Acta Materialia, 2001, 49(19): 3899-3918.
- [10] 马永,姚晓红,田林海,等.利用纳米压入的反演分析法 确定金属材料的塑性性能[J]. 金属学报,2011,47(3): 321-326.
- [11] 秦飞,项敏,武伟,纳米压痕法确定 TSV-Cu 的应力-应 变关系[J]. 金属学报,2014,50(6):722-726.
- [12] 陈旭. Sn-Bi 基焊料组织与性能的研究[D]. 南京:东南 大学,2017:1-4.
- [13] ZHANG Liang, HAN Jiguang, HE Chengwen, et al. Reliability behavior of lead-free solder joints in electronic components [J]. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2012, 24(1): 172-190.
- KAYA H, BÖYÜK U, ÇADIRLI U, et al. Dependency $\lceil 14 \rceil$ of microstructural parameters and microindentation hardness on the temperature gradient in the In-Bi-Sn ternary alloy with a low melting point [J]. Metals & Materials Internation, 2018, 14(5): 575-582.
- WANG Tonghong, FANG Tehua, LIN Yucheng. Fi-[15] nite-element analysis of the mechanical behavior of Au/ Cu and Cu/Au multilayers on silicon substrate under nanoindentation[J]. Applied Physics A, 2008, 90(3): 457-463.
- ZHUK D I, ISAENKOVA M G, PERLOVICH Y A, et $\lceil 16 \rceil$ al. Finite element simulation of microindentation [J]. Russian Metallurgy (Metally), 2017(5): 390-396.
- ANTUNES J M, FERNANDES J V, MENEZNS L F, et al. A new approach for reverse analyses in depth-



sensing indentation using numerical simulation[J]. Acta Materialia, 2007, 55(1):69-81.

[18] LEE J M, LEE C J, KIM B, Reverse analysis of nano-

indentation using different representative strains and residual indentation profiles[J]. Materials and Design, 2009, 30(9):3395-3404.

编辑:张所滨